

D1NL40U**400V 0.9A****特長**

- 低ノイズ
- trr=25ns

Feature

- Low Noise
- trr=25ns

用途

- スイッチング電源
- フライホール
- 家電、OA、照明
- 通信、FA

Main Use

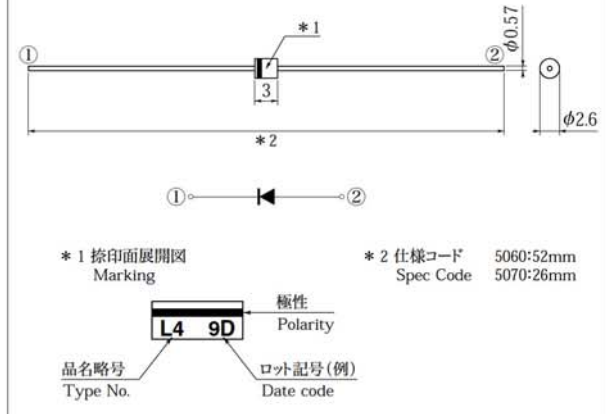
- Switching Regulator
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation

■外観図 OUTLINE

Package : AX057

Unit:mm

Weight 0.19g (Typ)



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

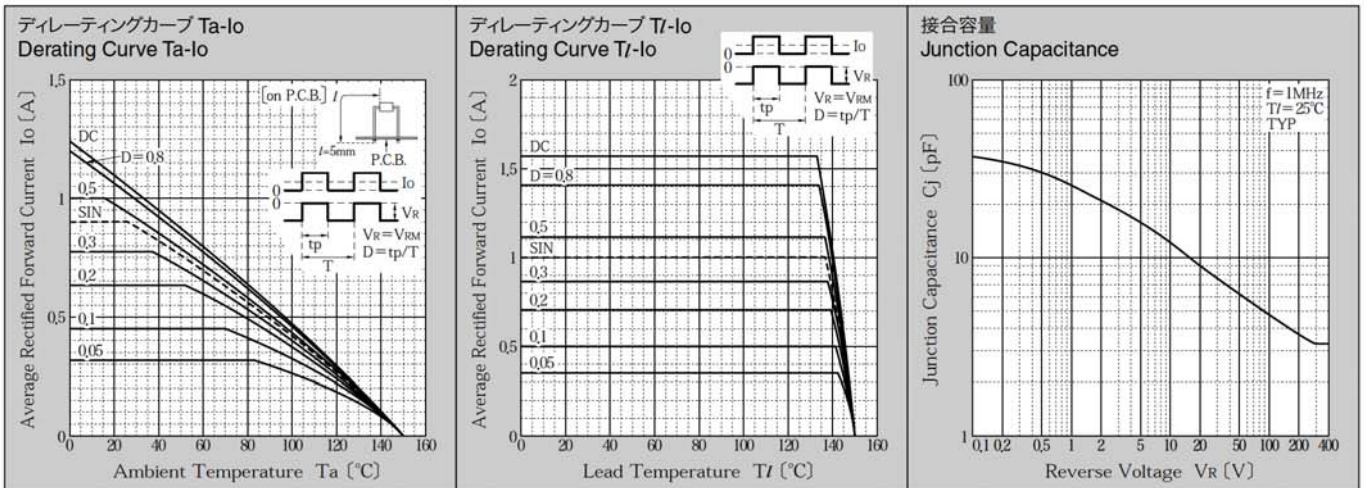
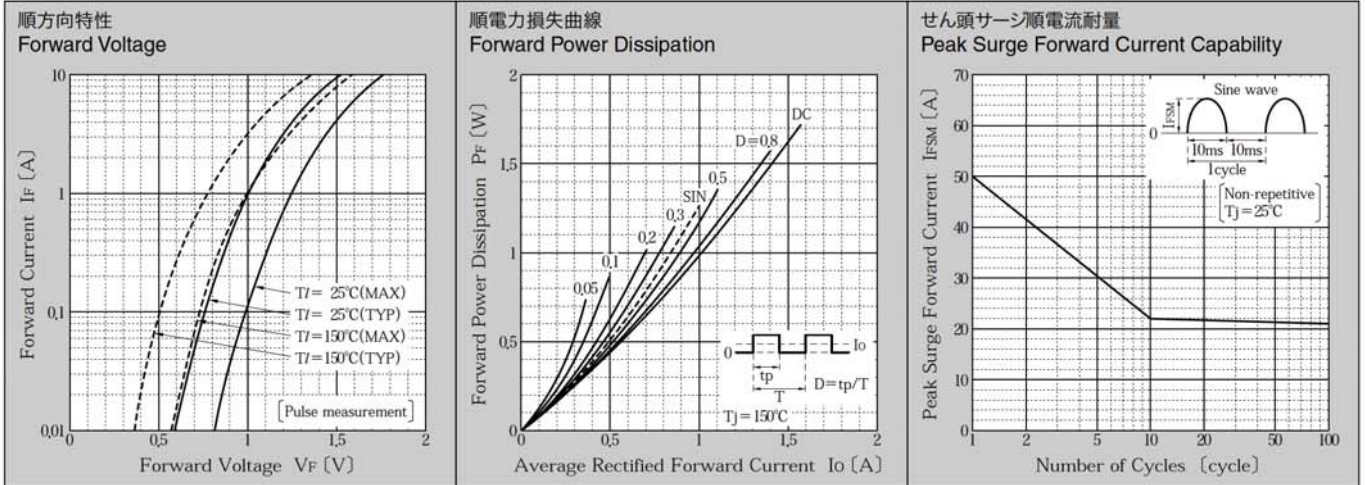
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1NL40U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	$T_a = 25^\circ\text{C}$	0.9	A
			$T_I = 137^\circ\text{C}$	1	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		50	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.25	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 400\text{V}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5\text{A}$, $I_R = 1\text{A}$, $0.25I_R$	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$,	TYP 12	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 10	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装, $l = 5\text{mm}$ Junction to ambient, On glass-epoxy substrate $l = 5\text{mm}$	MAX 113	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 * Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 * Typical is a statistical average of the device's ability.